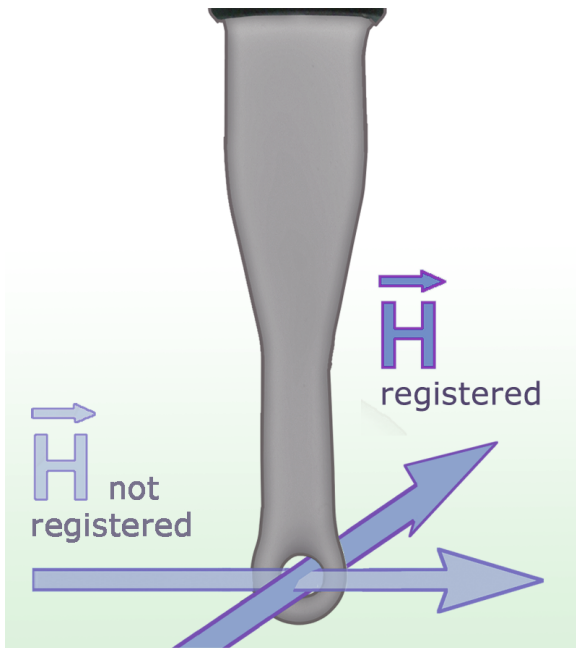


# XFS-R 3-1

Scanner-sonde 30 MHz bis 6 GHz



## Kurzbeschreibung

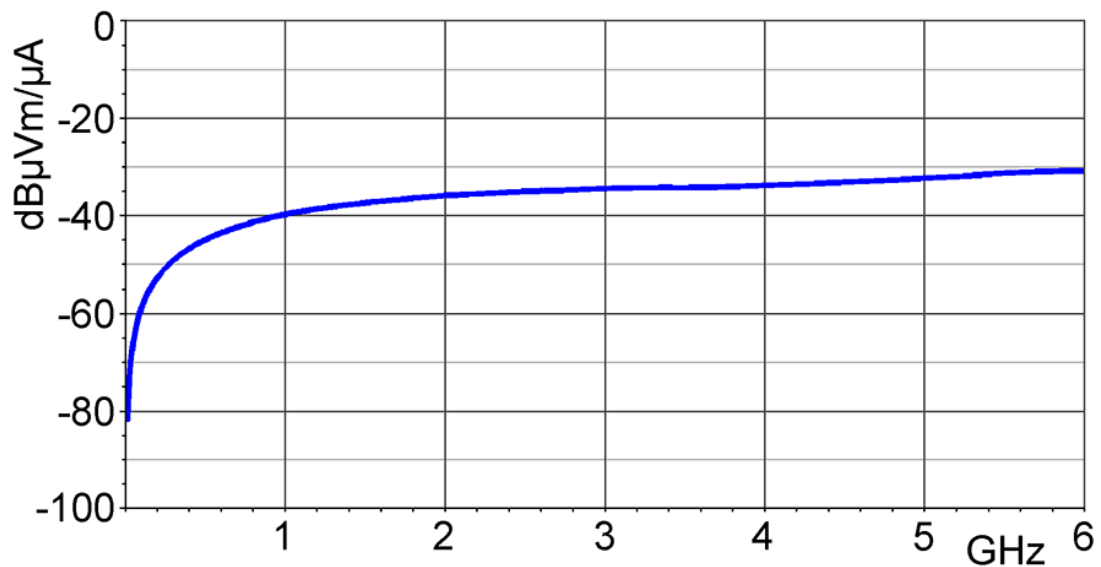
Die Scanner-sonde XFS-R 3-1 dient der Messung von HF-Magnetfeldern mit hoher Auflösung auf der Baugruppe, z.B. im Bereich um Pins und Gehäuse von ICs, Leiterzügen, Stützkondensatoren und EMV-Bauelementen.

Die Magnetfeldscanner-sonde XFS-R 3-1 ist für Messungen dicht an Bauelementen im Bereich hoher magnetischer Feldstärken geeignet. Die Nahfeldsonde hat eine Mantelstromdämpfung und ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50  $\Omega$  Eingang angeschlossen. Die Magnetfeldscanner-sonde besitzt intern einen Abschlusswiderstand.

## Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 6 GHz
Auflösung	$\approx 1$ mm
Maße Sondenkopf	$\varnothing \approx 3$ mm
Anschluss - Ausgang	SMA, male, jack

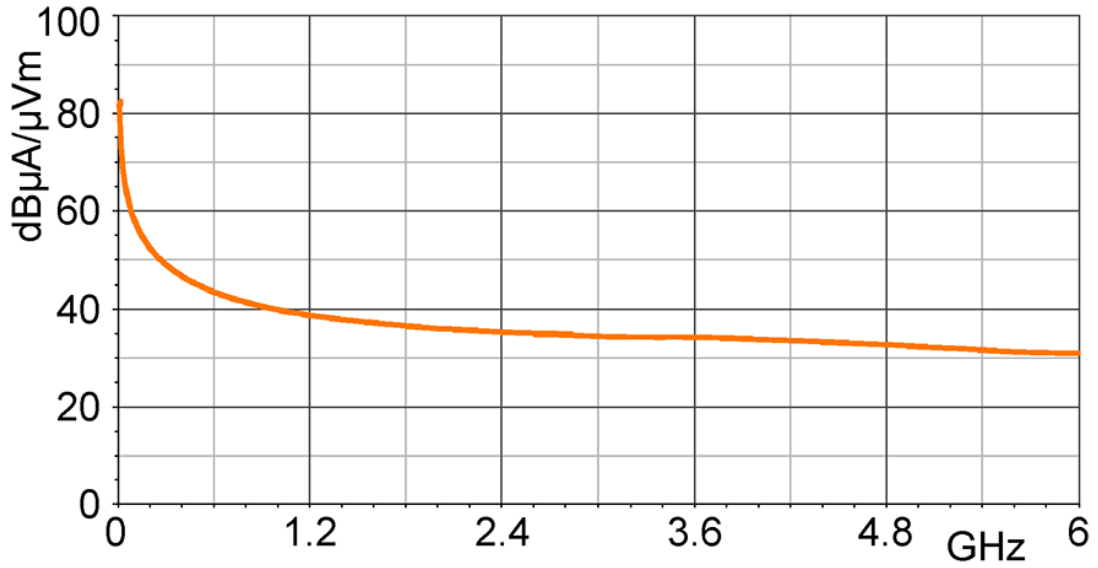
Frequenzgang [dB $\mu$ V] / [dB $\mu$ A/m]



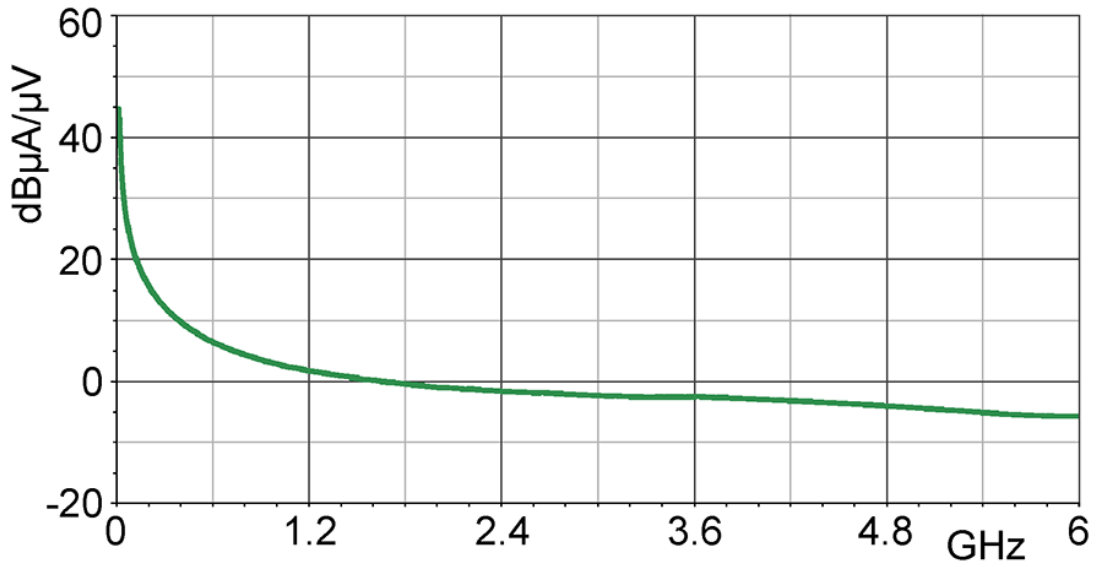
# XFS-R 3-1

Scannersonde 30 MHz bis 6 GHz

Korrekturkurve H-Feld [dB $\mu$ A/m] / [dB $\mu$ V]



Korrekturkurve Strom [dB $\mu$ A] / [dB $\mu$ V]



# XFS-R 3-1

Scannersonde 30 MHz bis 6 GHz

Messprinzip

